

УДК 536.341.08

ВЛИЯНИЕ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ РЕШЕТКИ НА СПЕКТР ЭКСИТОНА В СУПЕРИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

*И. Х. Акопян, Д. Н. Громов, А. А. Клочихин,
Б. В. Новиков, С. Г. Оглоблин*

Изучается экспериментально и теоретически влияние разупорядочения решетки на экситонные состояния суперионных кристаллов. Измерена спектральная плотность экситонных состояний суперионных кристаллов типа AgI в широком интервале температур как выше, так и ниже температуры суперионного перехода.

Предположено, что длинноволновый хвост спектральной плотности возникает вследствие локализации экситона во флуктуационном потенциале. Большая ширина экситонного максимума объясняется сильным экситон-фононным взаимодействием в этих кристаллах.

Развита теория, учитывающая многократное перерассеяние в случайном потенциале; нормированная спектральная плотность выражена через усредненную матрицу рассеяния. Предположено, что потенциал описывается статистикой гауссовского белого шума и используется репличное представление для усреднения по потенциальному. Вычисление усредненной матрицы рассеяния в области локализованных состояний экситона выполнено методом Липатова—Брезина—Паризи. Экспериментальная зависимость матрицы рассеяния от энергии восстановлена по спектральной плотности после выделения эффектов экситон-фононного взаимодействия. Проведено сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей.

Суперионные проводники (СИП) в высокотемпературной фазе представляют собой особый класс твердых тел, в которых структурное разупорядочение наблюдается в системе одного типа ионов, в то время как другие сохраняют регулярную решетку [1]. Так, в кристаллах типа AgI при $T > T_c$ разупорядочение охватывает всю катионную подрешетку. Естественно ожидать, что структурное разупорядочение решетки будет отражаться и на электронных состояниях кристалла и, в частности, на его оптических свойствах вблизи края собственного поглощения. Исследование оптических спектров СИП предоставляет интересную возможность исследования неупорядоченных систем с регулируемой температурой степенью беспорядка. Известно [4], что в широкой области $T \leqslant T_c$ число разупорядоченных ионов уже велико и по крайней мере в некоторых кристаллах может обратимо меняться с температурой.

Исследование экситонных состояний СИП до настоящего времени было ограничено спектрами отражения [2, 3]. Было показано, что структура, отвечающая прямым разрешенным экситонным переходам, испытывает при переходе в суперионное состояние скачкообразное уширение, но сохраняется в спектрах суперионной модификации. Качественно данные по температурным изменениям спектров отражения СИП похожи на зависимости спектров отражения твердых растворов от концентрации компонент [4, 5]. В [2] предпринималась попытка связать наблюдаемые эффекты с разупорядочением катионной решетки и был предложен вариант уравнения когерентного потенциала для описания спектральной плотности экситона.

В данной работе проведено исследование края собственного поглощения группы суперионных кристаллов (AgI , Ag_2HgI_4 , RbAg_4I_5) в широком интервале температур как выше, так и ниже температуры суперионного

перехода T_c . Обнаруженные общие для всех исследованных кристаллов закономерности в частотной и температурной зависимостях коэффициента поглощения связываются с локализацией экситона в ямах флуктуационного потенциала, создаваемого структурным разупорядочением. Для объяснения экспериментальных результатов проводится теоретический расчет, в основе которого лежит описание флуктуационного потенциала статистикой гауссовского белого шума [6, 7] и метода вычислений [8].

1. Экспериментальные результаты и их обработка

Экспериментальные результаты и их интерпретация. Спектры пропускания изучались на установке на базе МДР-2 с дисперсией 1.5 нм/мм. Температура образцов поддерживалась с точностью ± 0.5 К. Коэффициент поглощения $\bar{\alpha}(\omega)$ рассчитывался по величине пропускания с учетом отражения.

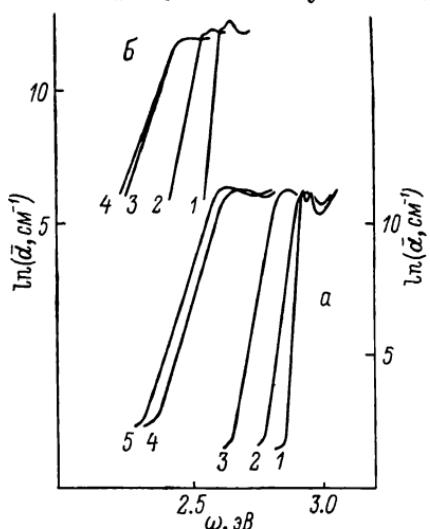


Рис. 1. Спектры поглощения кристаллов AgI (a) при $T=100, 300, 413, 425$ и 500 К (кривые 1–5) и Ag_2HgI_4 (б) при $T=100, 296, 320$ и 350 К (кривые 1–4).

Структура кривой 1 на рис. 1, а связана с тем, что при данной температуре кристалл состоит из смеси двух модификаций.

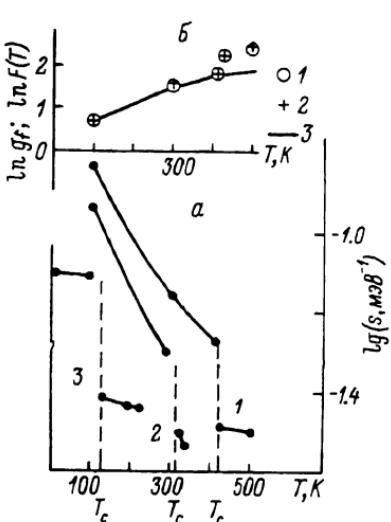


Рис. 2.

a — зависимость наклона линейного участка $\ln \bar{\alpha}$ и параметра флуктуационного потенциала ω_0 от температуры для кристаллов AgI (1), Ag_2HgI_4 (2) и RbAg_4I_5 (3). Зависимости a и ω_0^{-1} совпадают с точностью до постоянного множителя, соотношение между ними для выбранного модельного контура имеет вид $\ln(0.10077/\omega_0) = \ln s$. б — зависимость константы экситон-фонового взаимодействия от температуры для кристалла AgI : 1 — оценка по контуру линии, 2 — результат подгонки спектра с использованием модельного контура, 3 — зависимость температурного фактора $F(T) = (2n(Q_f) + 1)$ при $Q_f = 12$ мэВ.

В случае AgI использовались три набора образцов: поликристаллические пленки толщиной 0.08—0.5 мкм (для коэффициентов поглощения $\bar{\alpha}$ порядка 10^4 — 10^6 см^{-1}) и монокристаллические пластинки толщиной 150—250 мкм (для $\bar{\alpha} \sim 10^2$ — 10^3 см^{-1}) и толщиной 600—1500 мкм (для $\bar{\alpha} \sim 10$ — 10^2 см^{-1}), полученные скалыванием объемных кристаллов перпендикулярно оси C_6 . Кристаллы были выращены по методу [9]. Спектры пропускания Ag_2HgI_4 получены на поликристаллических пленках и выращенных по методу [10] монокристаллических пластинках толщиной 300—500 мкм. В случае RbAg_4I_5 исследовались только поликристаллические пленки. Поликристаллические пленки готовились по методу [11], их толщина изменялась на интерферометре МИИ-4.

На рис. 1 приведены зависимости $\ln \bar{\alpha}(\omega)$ для кристаллов AgI и Ag_2HgI_4 . В каждой из кривых экситонного поглощения можно различить два характерных структурных элемента: длинноволновый хвост, где частотная зависимость $\ln \bar{\alpha}$ близка к линейной, и коротковолновый максимум.

Эти структурные элементы имеют различную зависимость от температуры. Для всех изученных кристаллов при повышении температуры наблюдается сильное возрастание ширины максимумов экситонных полос (Δv), сопровождающееся увеличением протяженности длинноволнового хвоста. При этом, однако, наклон линейного участка $\ln \alpha(\omega)$ изменяется с температурой заметно медленнее, чем ширина коротковолнового максимума. В точке фазового перехода наблюдаются скачкообразные изменения Δv и наклона хвоста.

Обращает на себя внимание тот факт, что длинноволновое крыло края (хвост) хорошо аппроксимируется универсальной зависимостью от частоты

$$\ln \alpha(\omega) = -s\omega \quad (1)$$

в достаточно широком интервале температур как $T < T_c$, так $T > T_c$, так что изменением масштаба по шкале частот можно с хорошей точностью

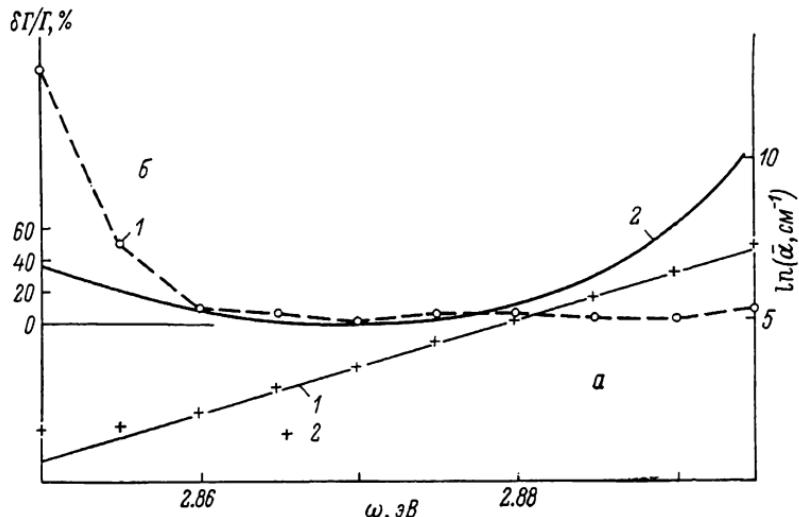


Рис. 3.

a — зависимость $\ln \alpha = -s\omega$ при $s = 0.1452 \text{ мэВ}^{-1}$ (1) и экспериментальные значения $\ln \alpha$ для AgI в области хвоста при $T = 100 \text{ К}$ (2). *b*: 1 — отклонение экспериментальных значений $\Gamma(\omega)$ от идеальной, полученных при $s = 0.1452 \text{ мэВ}^{-1}$; 2 — отклонение асимптотики $\Gamma(\omega)$ (формула (14)), вычисленной при $\omega_0 = 0.694 \text{ мэВ}$, от значений Γ , соответствующих линейной зависимости $\ln \alpha$ при $s = 0.1452 \text{ мэВ}^{-1}$. Параметры соответствуют кристаллу AgI при $T = 100 \text{ К}$.

совмещать эти участки спектров, полученные при различных температурах. Это обстоятельство указывает на единую природу хвоста во всей области температур. Наличие скачка в Δv и s при $T = T_c$ позволяет связать обсуждаемые эффекты с разупорядочением в подрешетке Ag^+ . Единообразный характер хвоста выше и ниже T_c показывает, что значительное частичное разупорядочение возникает уже при температурах ниже суперионного перехода.

На рис. 2, *a* приведены зависимости от температуры s -показателей экспонент линейных участков спектров, а на рис. 3, *a* приведена частотная зависимость $\ln \alpha$ в области хвоста при $T = 100 \text{ К}$ кристалла AgI, откуда видна величина отклонений экспериментальных точек от линейной зависимости (1). Из рис. 2, *a* видно, что для RbAg_4I_5 при $T < 90 \text{ К}$ зависимость s от температуры отсутствует, что может быть объяснено «замораживанием» при этих температурах беспорядка. В этом кристалле при $T < 90 \text{ К}$ изменяется только ширина максимума.

Мы связываем появление длинноволнового хвоста в спектрах поглощения СИП с локализацией экситона в ямах флуктуационного потенциала, создаваемого разупорядоченными ионами и вакансиями, а большую ширину экситонных полос объясняем сильным экситон-фононным взаимодействием, характерным для исследованной группы кристаллов. Заметим, что данные

по резонансному рассеянию света в кристалле AgI [12] также указывают на большие величины констант взаимодействия с фононами.

Для единообразной интерпретации всех наблюдаемых спектров мы будем предполагать, что: а) спектральный ход хвоста отражает неоднородное уширение бесфононной линии 1s-состояния экситона; б) все наблюдавшиеся спектры имеют в своей основе один и тот же бесфононный контур $\alpha(\omega)$, а отличие состоит лишь в масштабе, который определяется наклоном линейного участка $\ln \alpha$; в) различие в профилях полных коэффициентов поглощения возникает из-за разных констант экситон-фононного взаимодействия и получающихся в результате этого разных соотношений полной ширины полосы $\alpha_{\text{эфф}}(\omega)$ и энергии связи экситона.

Анализ контура электронно-колебательной полосы. Соотношение между контуром бесфононной полосы и контуром электронно-колебательной $\alpha_{\text{эфф}}$ имеет вид [13]

$$\alpha_{\text{эфф}}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha(\omega - z) F(z) dz. \quad (2)$$

Функция $F(z)$ может быть найдена по константе взаимодействия g_f и спектру фононов [13]. Для сильного экситон-фононного взаимодействия она имеет вид колокола с максимумом при $z = g_f \Omega_f$, где Ω_f — частота фона, наиболее эффективно взаимодействующего с экситоном. Отсюда следует, что в области хвоста, где $\alpha(\omega)$ меняется плавно,

$$\alpha_{\text{эфф}}(\omega) \approx \alpha(\omega - g_f \Omega_f), \quad (3)$$

т. е. функциональные зависимости $\alpha_{\text{эфф}}$ и α совпадают, когда g_f не зависит от глубины уровня. Поскольку для кристалла RbAg₄I₅ линейный характер зависимости $\ln \alpha$ не изменяется при изменении температуры, мы будем считать, что g_f не зависит от глубины экситонных уровней и наблюдаемая зависимость хвоста совпадает с зависимостью $\alpha(\omega)$.

Оценим теперь величины констант экситон-фононной связи. Из (2) следует, что отклонение от линейной зависимости $\ln \alpha_{\text{эфф}}(\omega)$ возникает при $\omega \approx E_0$, где E_0 — положение максимума бесфононного контура, а максимум $\alpha_{\text{эфф}}(\omega)$ будет расположен при $\omega = E_{\max} \approx E_0 + g_f \Omega_f$. Поэтому оценка константы связи получается измерением расстояния между максимумом экситонно-колебательной полосы $\alpha_{\text{эфф}}$ и началом линейного участка $\ln \alpha$ и делением этой величины на энергию фона Ω_f . На рис. 2, б приведены полученные таким образом значения для кристалла AgI. Видно, что температурная зависимость константы экситон-фононного взаимодействия хорошо описывается температурным фактором, что и должно быть для электронно-колебательной полосы.

Ограничения на контур бесфононной полосы. Знание контура бесфононной полосы дает возможность сопоставить экспериментальные данные и теорию, сравнить данные, полученные для разных кристаллов, провести более точное определение констант экситон-фононной связи и модельные расчеты полных коэффициентов поглощения. Полученные экспериментальные данные позволяют установить вполне определенные ограничения на параметры контура неоднородной полосы. Мы исходим из предположения, что 1s-полоса представляет собой бесструктурный максимум с монотонным падением α в обе стороны, причем закон убывания длинноволнового хвоста совпадает с наблюдаемым экспериментально. Такая полоса не может быть уже 8—10 мэВ, так как иначе проявилась бы тонкая структура электронно-колебательной полосы. Эта полоса не может быть шире, чем полная электронно-колебательная полоса, а закон спадания коротковолнового крыла α должен быть более быстрым, чем для полной полосы. Для определения последнего ограничения оказалось удобным использовать спектр AgI при 100 К. Было проведено разделение контуров

полосы 1s-состояний экситона двух модификаций на два подобных контура. Результаты деления приведены на рис. 4. Полученные значения полуширины (35 мэВ) и наклона коротковолнового участка полосы (прямая 3б) дают необходимые ограничения. Более сильное ограничение на максимальное значение полуширины бесфононного контура получается, когда одновременно с требованием совпадения наклона длинноволнового крыла с прямой 3а рис. 4 и ограничением 3б учитывается требование равенства нулю первого момента полосы [8]. Это уменьшает приведенную оценку максимального значения полуширины бесфононной полосы в данном случае до

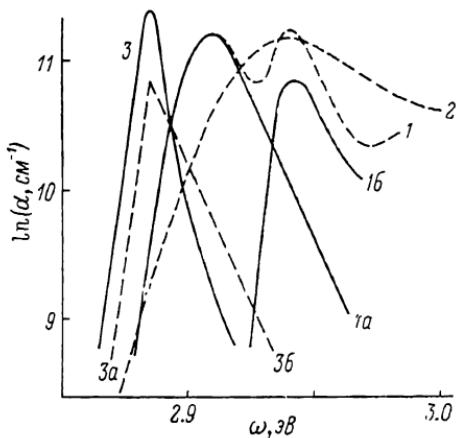


Рис. 4.

1 — контур полосы 1s-состояний экситона кристалла AgI при 100 К, 1а и 16 — результаты разделения контура; 2 — контур полосы AgI при 300 К (символами начата линейных участков кривых 1а и 2); 3 — модельный контур бесфононной полосы при 100 К, 3а и 3б — наклоны длинноволнового и коротковолнового крыльев контура 1а.

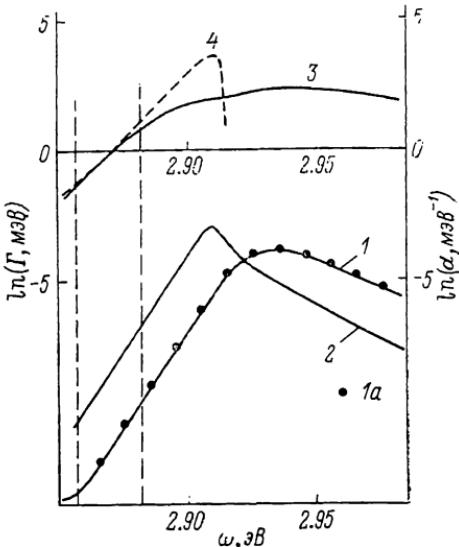


Рис. 5.

1 — контур полосы 1s-состояния экситона кристалла AgI при 100 К, 1а — электронно-колебательный контур, полученный в результате расчета; 2 — модельный контур, использованный в расчете; 3 — функция $G(\omega)$, соответствующая контуру 2; 4 — асимптотика $G(\omega)$, вычисленная по формуле (14) при $\omega_0 = 0.694$ мэВ. Вертикальными штриховыми линиями выделена область энергий, где кривые 3 и 4 близки по величине.

15–20 мэВ. Приведенный на рис. 4 контур 3 представляет собой один из возможных вариантов контура бесфононной полосы, удовлетворяющий всем ограничениям. Возможные отклонения от полуширины по нашим оценкам не превышают ± 5 мэВ. Этот контур был использован во всех вычислениях.

2. Теория

Мы предполагаем, что движение экситона как целого определяется крупномасштабным флуктуационным потенциалом, который создается в результате разупорядочения, и рельеф потенциала описывается гауссовским белым шумом

$$H = H_R + h_r, \quad H_R = -\frac{\hbar}{2M} \Delta_R - V(R), \quad h_r = -\frac{\hbar}{2\mu} \Delta_r - \frac{e^2}{\epsilon_0 r}, \quad \left. \begin{aligned} \langle V(R) V(R') \rangle &= w^{2\delta} (R - R'), \\ \langle V(R) \rangle &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Здесь H_R , h_r — гамильтонианы центра тяжести экситона и его относительного движения, M и μ — трансляционная и приведенная массы, ϵ_0 — эффективная диэлектрическая проницаемость. Выбор гамильтониана в виде (4) сводит задачу о движении экситона в случайном потенциале к одночастичной. Одночастичный вариант теории должен быть пригоден для описания экситона, когда $m_h \gg m_e$ и флуктуационный потенциал действует в основном на дырки.

Последовательный метод вычисления функций Грина в двух- и трехмерном случаях был развит в [8, 14, 15]. Он состоит в использовании репличного представления для вычисляемой функции Грина, что позволяет провести в общем виде гауссовское усреднение, после чего задача сводится к О-компонентной теории поля Φ^4 с притягивающим знаком взаимодействия. Эта теория в двух- и трехмерном случаях требует регуляризации. В [8] был предложен способ регуляризации, состоящий в вычитании из функционала действия однопетлевой диаграммы, что устраняет ультрафиолетовую расходимость теории. В замкнутом виде ответ удается получить в пределе отрицательных энергий в одноинстанционном приближении [16]. Предел применимости этого приближения при увеличении энергии ограничен нарастанием мультиинстанционных поправок.

Прежде всего выясним, какую функцию необходимо вычислить для наиболее удобного сопоставления экспериментальных данных и теории. Для этой цели используем выражение для нормированного на единицу коэффициента поглощения $\alpha(\omega)$ через усредненную по конфигурациям функцию Грина экситона в кристалле и матрицу рассеяния [17]

$$\left. \begin{aligned} \alpha(\omega) &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \tilde{G}(\mathbf{k}, \omega), \quad k \approx 0, \\ \tilde{G}(\mathbf{k}, \omega) &= G_0(\mathbf{k}, \omega) + G_0^2(\mathbf{k}, \omega) \tilde{T}_{\mathbf{kk}}(\omega), \\ G_0(\mathbf{k}, \omega) &= \left[\frac{\hbar^2 k^2}{2M} - \omega - i\delta \right]^{-1} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Подставляя \tilde{T} в виде $\tilde{T} = T [1 - G_0 T]^{-1}$ в (5), получаем

$$\alpha(\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma_{00}(\omega)}{(\omega - \Delta_{00}(\omega))^2 + \Gamma_{00}^2(\omega)}, \quad \Gamma = \operatorname{Im} T, \quad \Delta(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Gamma(z) dz}{\omega - z}. \quad (6)$$

Вследствие $\langle V(\mathbf{R}) \rangle = 0$ Δ не содержит постоянного слагаемого. Для существования не равного нулю ответа необходимо, чтобы интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(\omega) d\omega = \Omega_0^2$ был конечен. Полный коэффициент поглощения $\tilde{\alpha}$ получается суммированием вкладов дискретного и непрерывного спектров экситона с учетом их сил осцилляторов. Из (6) видно, что мнимая часть матрицы рассеяния наиболее удобна для сравнения с экспериментом, так как для вычисления $\alpha(\omega)$ необходимо найти $\Delta_{00}(\omega)$, т. е. знать $\Gamma_{00}(\omega)$ во всем интервале энергий, в то время как теория может дать только асимптотику $\Gamma_{00}(\omega)$.

Рассмотрим теперь путь нахождения $\Gamma_{00}(\omega)$ из экспериментальных данных. Будем считать, что экспериментальная зависимость $\alpha(\omega)$ нам известна и построим по α соответствующую ей вещественную часть

$$r(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha(z)}{\omega - z} dz. \quad (7)$$

Решая уравнение

$$r + i\alpha = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\omega - \Delta_{00} - i\Gamma_{00}}, \quad (8)$$

получаем

$$\Gamma_{00}(\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\alpha(\omega)}{r^2(\omega) + \alpha^2(\omega)}, \quad \Delta_{00}(\omega) = \omega - \frac{1}{\pi} \frac{r(\omega)}{r^2(\omega) + \alpha^2(\omega)}. \quad (9)$$

Первая формула нам дает простое выражение Γ_{00} через α . Подставляя это выражение в дисперсионное соотношение (6) и сравнивая со второй формулой (9), мы видим, что имеет место соотношение

$$\omega - \frac{1}{\pi} \frac{r(\omega)}{r^2 + \alpha^2} - \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\omega - z} \frac{\alpha(z)}{r^2(z) + \alpha^2(z)} = 0, \quad (10)$$

которое следует из равенства нулю интеграла

$$\frac{1}{2\pi i} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\omega - z - i\delta} \left(\frac{1}{r(z) - i\alpha(z)} - \pi z \right) \equiv 0, \quad \delta \rightarrow 0. \quad (11)$$

Разлагая (10) в ряд по моментам, получаем

$$\int_{-\infty}^{\infty} \alpha(\omega) \omega d\omega = 0, \quad (12)$$

Этот результат отражает тот факт, что при $\langle V \rangle = 0$ для рождения экситона в присутствии флуктуационного потенциала необходимо затратить в среднем по спектру такую же энергию, как и в его отсутствие. Соотношение (12) является следствием симметрии функции распределения флуктуационного потенциала и равным образом справедливо для всех трех размерностей; оно выполняется для точного решения [6] одномерной задачи. Зная зависимость $\alpha(\omega)$, с помощью (12) можно найти положение дна зоны виртуального кристалла, т. е. начало координат для сравнения (9) и теоретической асимптотики, полученной для гамильтониана (4). Таким образом, соотношения (9) и (12) дают возможность сравнить экспериментально измеренную спектральную плотность с теоретической асимптотикой.

Для вычисления Γ запишем T в репличичном представлении

$$T_{kk}(\omega) = \frac{1}{v} \int d^3R \int d^3R' e^{i\mathbf{k}(\mathbf{R}-\mathbf{R}')} \omega \lim_{n \rightarrow 0} \prod_{i=1}^n D[\Psi_i(R)] \Psi_1(R) \Psi_1(R') \times \left. \begin{aligned} & \times \left\langle \frac{\delta^2}{\delta \beta(R) \delta \beta(R')} \exp \{-S[\beta, \Psi]\} \right\rangle_{\beta=0}, \\ & S[\beta, \Psi] = \frac{1}{2} \int d^3x \left\{ \sum_{i=1}^n \left[(\nabla \Psi_i)^2 + \Psi_i^2 - \frac{V(x)}{\omega} \Psi_i^2 \right] + 2\beta(x) \frac{V(x)}{\omega} \right\}, \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

$$x = \left(\frac{2M\omega}{\hbar} \right)^{1/2} R, \quad v — \text{нормировочный объем.}$$

Результаты вычислений можно представить в виде

$$\Gamma_{kk}(\omega) = \pi \omega_0 C_k \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \exp \left\{ - \frac{I_4}{16\pi} \sqrt{\frac{\omega}{\omega_0}} \right\}, \quad (14)$$

$$C_k = \frac{4I_3^2(k)}{I_4} \frac{1}{4\pi^2} \left\{ \frac{I_4^{1/2}}{64\pi^2} \left[\left(\frac{I_8 - I_4}{3} \right)^3 \frac{D\left(\frac{1}{3}\right)}{D(1)} \right]^{1/2} \right\},$$

$$I_n = \int d^3x \Phi^n(x), \quad I_n(k) = \int d^3x e^{i\mathbf{y}\mathbf{x}} \Phi^n(\mathbf{x}), \quad y = \left(\frac{\hbar}{2M\omega} \right)^{1/2} k, \quad (15)$$

$I_3 = 31.688, I_4 = 75.585, I_6 = 659.928; D(1/3) = 1.4571, D(1) = 10.5602; \Phi(x) —$ убывающее на бесконечности как $\exp(-x)/x$ решение перевального уравнения

$$(-\Delta + 1 - \Phi^2)\Phi = 0. \quad (16)$$

3. Сравнение эксперимента и теории

Проверка контура бесфононной полосы. Полученный выше контур бесфононной полосы использовался для вычисления полных спектров поглощения экситона. Сначала находился контур электронно-колебательной полосы, причем спектр фононов принимался сплошным с максимальной частотой, равной 12 мэВ. Затем складывались результаты для всех состояний ридберговской серии экситона. Для разных температур и кристаллов исходные контуры бесфононной полосы отличались только масштабом, который изменялся в соответствии с изменением на-

клона $In \alpha$ длинноволнового хвоста спектральной плотности. Константы взаимодействия с фононами подбирались из условия наилучшего согласия с наблюдаемым спектром. На рис. 5 приведен контур бесфононной полосы и полосы $1s$ -состояния экситона в кристалле AgI при 100 K вместе с контуром, полученным с учетом экситон-фононного взаимодействия. Видно, что два последних контура практически совпадают. Получено хорошее согласие и во всех остальных случаях. Сравнение констант экситон-фононного взаимодействия, полученных в результате подгонки спектров поглощения, с оценкой этих констант, проведенной в разделе 1 (рис. 2, б), также показывает хорошее согласие.

Сравнение экспериментальной и теоретической матриц рассеяния. На рис. 5 приведена мнимая часть матрицы рассеяния для кристалла AgI при 100 K , вычисленная по бесфононному контуру и формуле (9). Там же приведена $\Gamma_{00}(\omega)$, полученная по формуле (14). Видно, что в глубине хвоста имеется область энергий, где эти две функции близки по величине. Более детальное сравнение этих функций (рис. 3, б) показывает, что в пределах экспериментального разброса $\Gamma_{00}(\omega)$ из (14) описывает наблюдаемую зависимость в области хвоста. Значения параметра флуктуационного потенциала (ω_0), полученные с помощью модельного контура для различных температур и кристаллов, вместе с величиной s приведены на рис. 2, б. Там же указана связь между ними.

Начиная с некоторой энергии, функция $\Gamma_{00}(\omega)$, построенная по экспериментальным данным, и $\Gamma_{00}(\omega)$, вычисленная по (14), начинают расходиться, что, очевидно, связано с непригодностью одноинстанционного приближения в этой области энергий [18]. Поскольку появление мультиинстанционных эффектов связано с понижением симметрии перевального решения в координатном пространстве, то в этой области энергий следует ожидать, например, расщепления вырожденных уровней экситона. В [19] такой эффект наблюдался по поляризационным зависимостям резонансного рассеяния (люминесценции).

Л и т е р а т у р а

- [1] Физика суперционных проводников. Сб. под ред. М. Б. Саламона. Рига: Зинатне, 1982. 315 с.
- [2] Bauer R. S., Huberman B. A. Phys. Rev., 1976, vol. B13, N 8, p. 3344–3349.
- [3] Акопян И. Х., Монов А. Е., Громов Д. Н., Мищенко А. В., Новиков Б. В., Яуфман М. Л. ФТТ, 1984, т. 26, № 9, с. 2629–2633.
- [4] Суслина Л. Г., Плюхин А. Г., Федоров Д. Л., Арешкин А. Г. ФТП, 1978, т. 12, № 11, с. 2238–2243.
- [5] Goede O., Hennig D., John L. Phys. St. Sol. (b), 1979, vol. 96, N 2, p. 671–681.
- [6] Halperin B. I. Phys. Rev., 1965, vol. A139, N 1, p. 104–117.
- [7] Halperin B. I., Lax M. Phys. Rev., 1966, vol. A148, N 2, P. 722–740.
- [8] Brezin E., Parisi G. J. Phys. C, 1980, vol. 13, N 12, p. 307–310.
- [9] Cochrane G. Brit. J. Appl. Phys., 1967, vol. 18, N 6, p. 687–688.
- [10] Nakada N., Ishizuki H., Ishihara N. Jap. J. Appl. Phys., 1976, vol. 15, N 10, p. 1589–1590.
- [11] Hilsch R., Pohl R. W. Z. Phys., 1928, vol. 48, N 5/6, p. 384–396.
- [12] Байрамов Б. Х., Личкова Н. В., Тимофеев Б. Д., Топоров В. В. ФТТ, 1983, т. 25, № 8, с. 2503–2506.
- [13] Марадудин А. А. Дефекты и колебательный спектр кристаллов, М.: Мир, 1968. 432 с.
- [14] Brezin H., Parisi G. J. St. Phys., 1978, vol. 19, N 3, p. 269–273.
- [15] Brezin E., Le Guilou J. C., Zinn-Justin J. Phys. Rev. D, 1977, vol. 15, N 6, p. 1544–1557.
- [16] Липатов Л. Н. Письма в ЖЭТФ, 1977, т. 25, № 2, с. 116–119.
- [17] Ньютона Р. Теория рассеяния волн и частиц. М.: Мир, 1969. 607 с.
- [18] Balitsky I. I., Yung A. V. Preprint IN PI-1127, 1985.
- [19] Permogorov S., Reznitsky A., Verbin S., Lysenko V. Sol. St. Commun., 1983, vol. 47, N 1, p. 5–9.